Search	Notes	

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/604,166	SINGH ET AL	•
Examiner	Art Unit	
Tae H Yoon	1714	

SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
524	267	1-2/8	-uz
	165		
528	196		
A10		12-27-04	m
•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	<u>.</u>		

INT	INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner	
			*	
			·	

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)		
	DATE	EXMR
EAST	7-4-05	Ry
Inventor Scarch		
•		
•		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
,		
	ļ	
•		